

CENTRE FRANÇAIS DE FIABILITE

# Diagnostic de défauts du convertisseur DC-DC pour véhicule hybride

Houcine CHAFOUK ([houcine.chafouk@esigelec.fr](mailto:houcine.chafouk@esigelec.fr))

Rouen, le 15 juin 2017



Centre Français Fiabilité



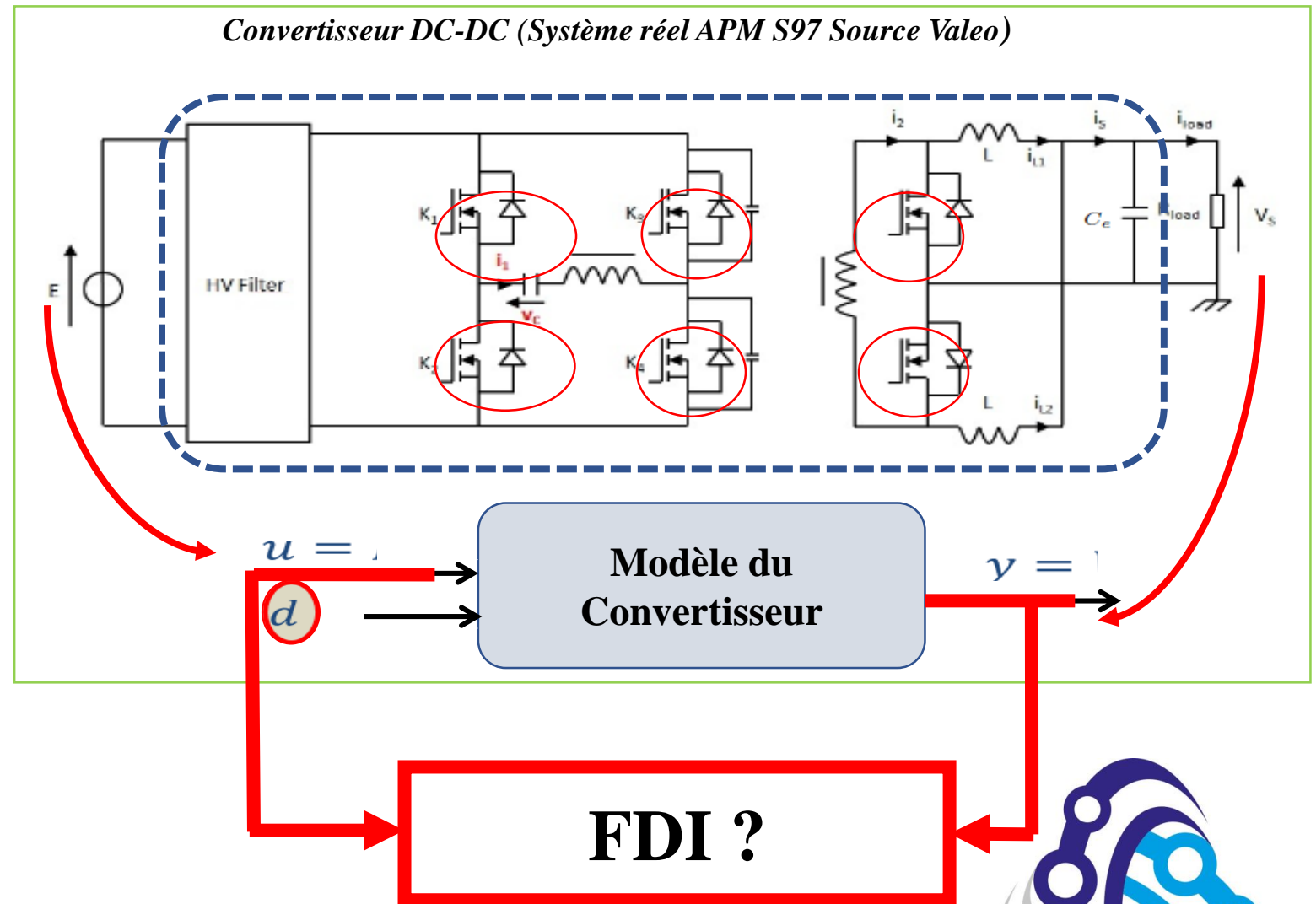
# objectifs

## ❑ Problématiques :

- Erreur de modélisation,
- Incertitudes des paramètres,
- Environnement bruité.

## ❑ Objectifs :

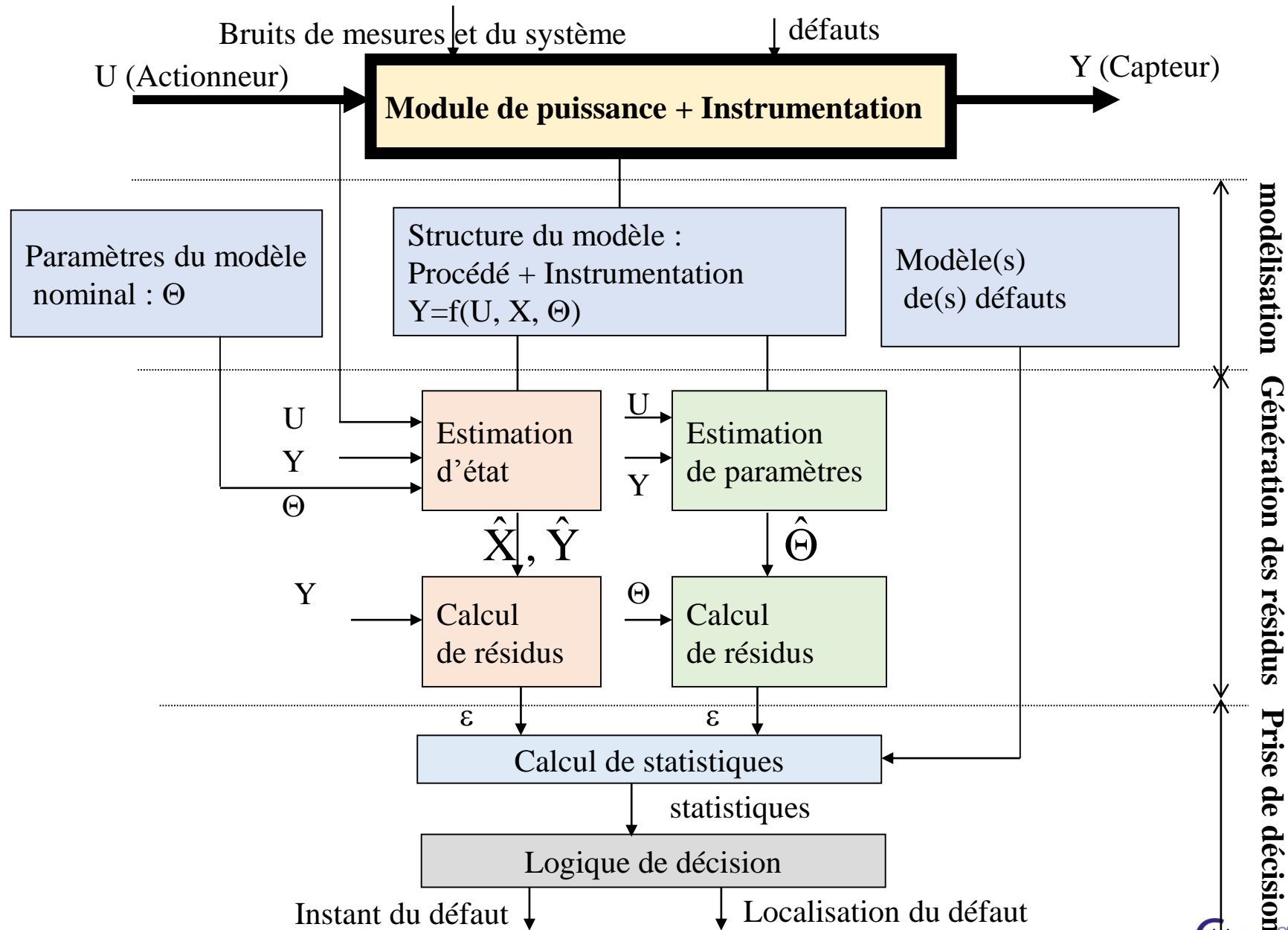
- Détection robuste de défauts,
- Localisation de défauts,
- Du diagnostic vers la fiabilité.



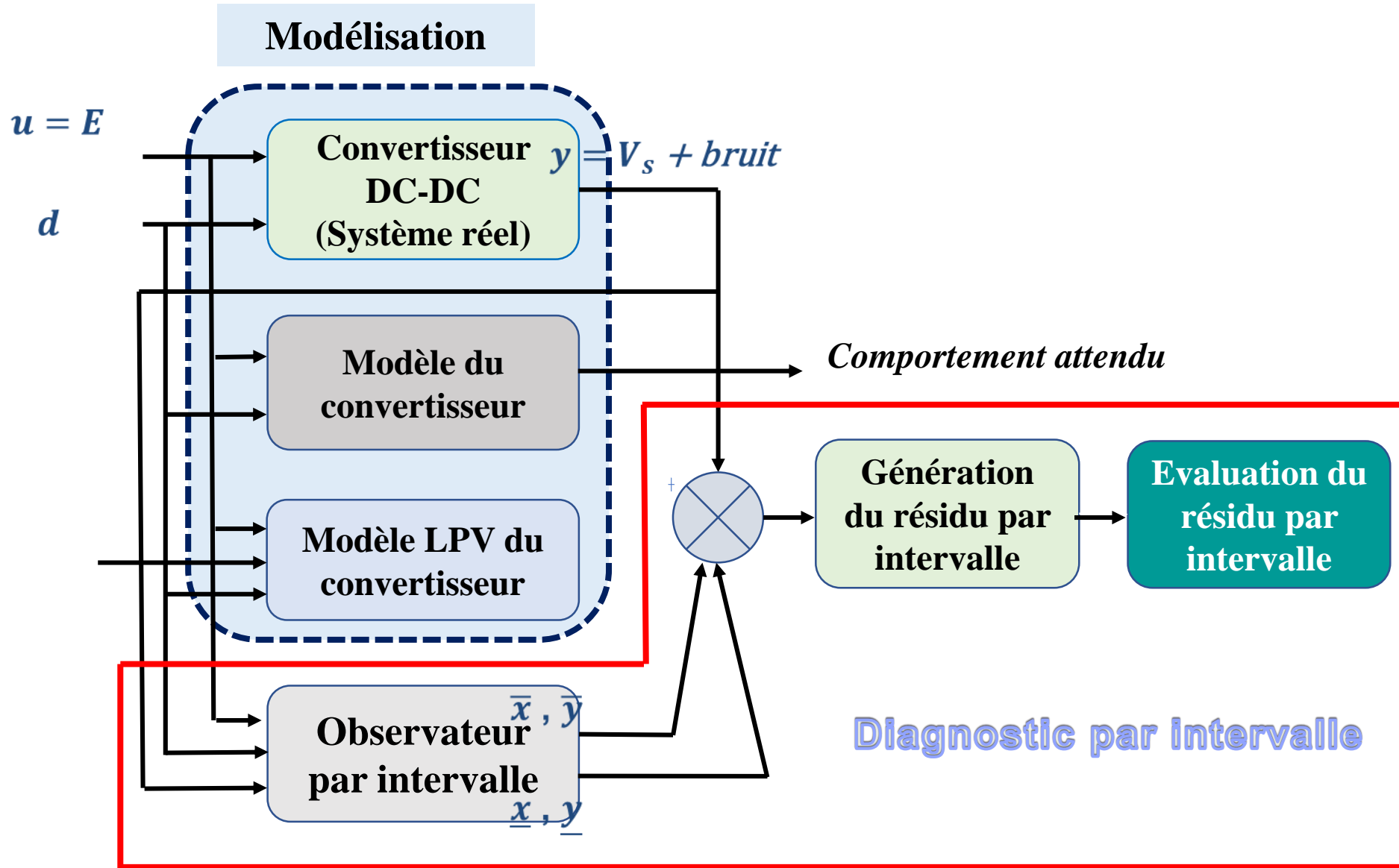
**Réaliser une méthode de Diagnostic de défauts à base d'observateurs par intervalles  
(en tenant compte des incertitudes et des perturbations)**

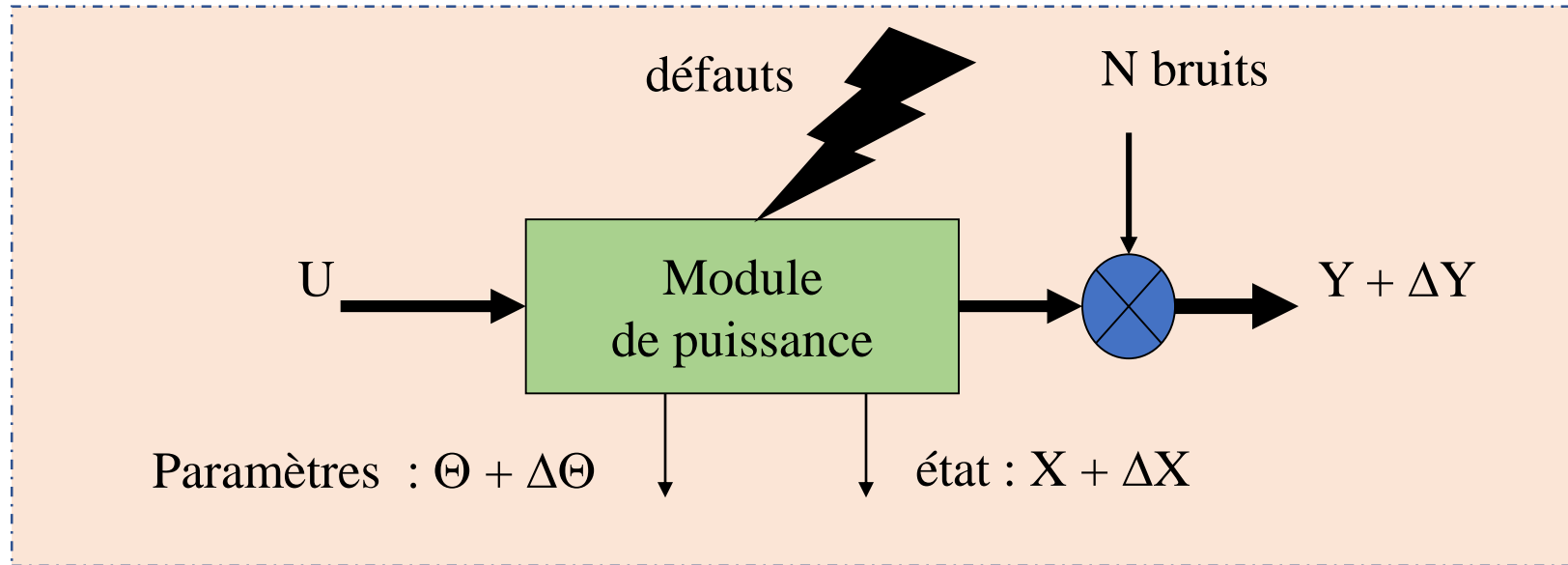


# Architecture du Diagnostic à base de Modèle



# Méthodologie de diagnostic proposée





- **Modèle du système :**

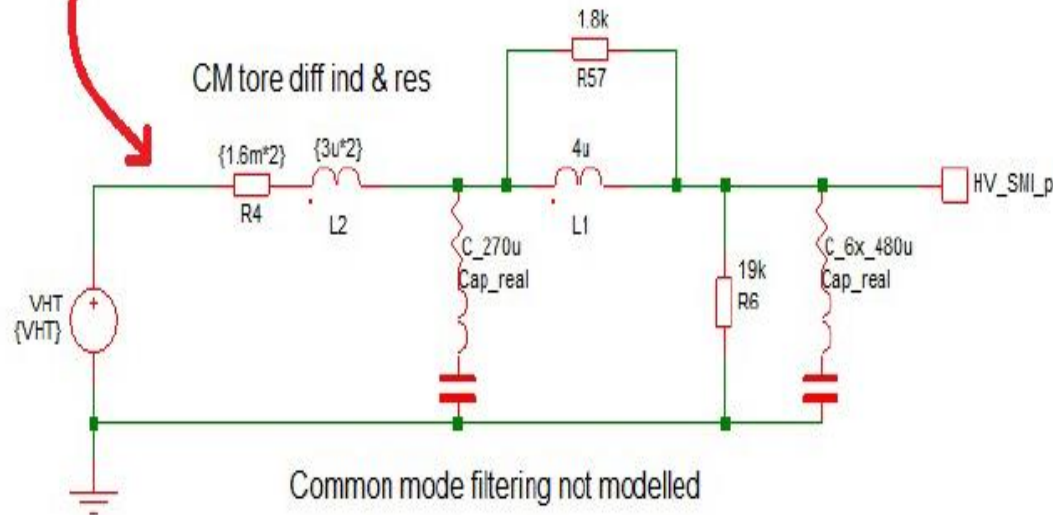
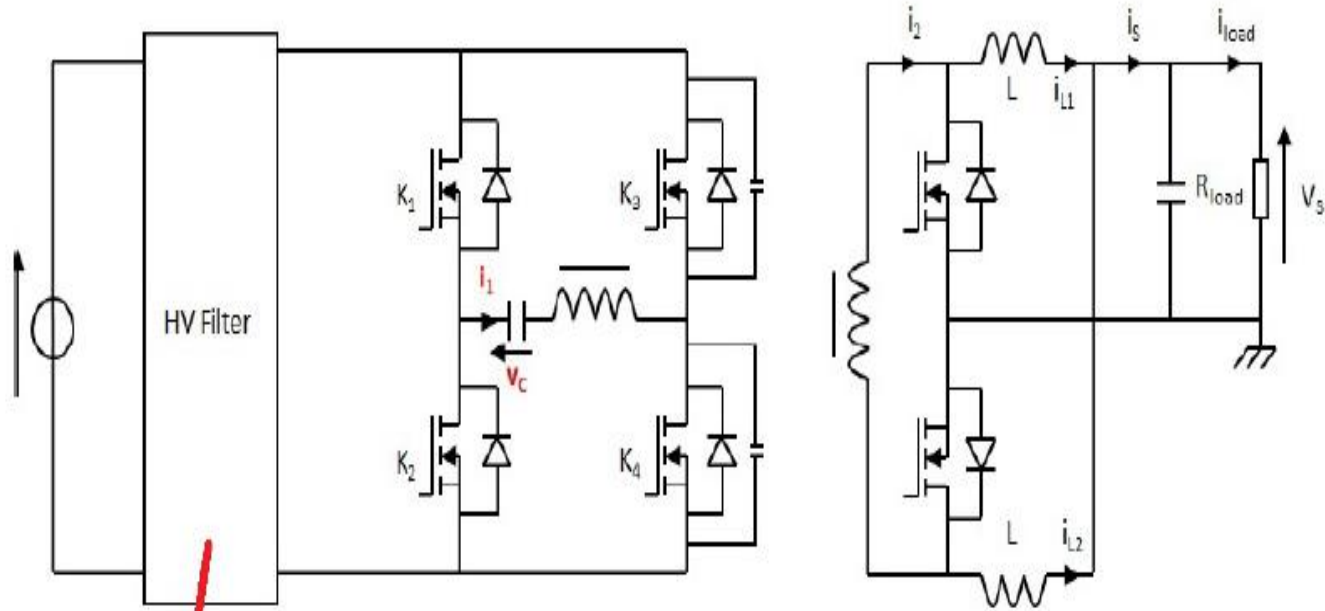
$$Y = f(U, \Theta, X, N)$$

- **Variables dont on peut tester l'évolution :**

- signaux mesurables :  $U, Y$
- États partiellement mesurables :  $X$
- Paramètres non mesurables mais estimables :  $\Theta$
- Quantités caractéristiques non mesurables :  $\eta = f(U, Y, \Theta)$



# Modélisation électrique



$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{V}_s = \frac{d}{C_s} I_{L1} - \frac{1}{C_s \cdot R_{load}} V_s + \frac{1-d}{C_s} I_{L2} \\ \dot{I}_{L1} = \frac{d}{L_1 + n^2 L_f + L_s} (n V_{c2} - n V_c - n^2 R_p I_{L1} - V_s) \\ \dot{I}_{L2} = \frac{1-d}{L_2 + n^2 L_f + L_s} (n V_{c2} - n V_c - n^2 R_p I_{L2} - V_s) \\ \dot{V}_c = \frac{n \cdot d}{C_s} I_{L1} + \frac{(1-d) \cdot n}{C_s} I_{L2} \\ \dot{V}_{c2} = \frac{1}{c_2} (I_e - \frac{1}{R_3} V_{c2} - n \cdot d \cdot I_{L1} - n \cdot (1-d) \cdot I_{L2} - I_1) \\ \dot{I}_e = \frac{1}{L_{11}} ((2 \cdot d - 1) E - V_{c1} - R_1 \cdot I_e) \\ \dot{V}_{c1} = \frac{1}{c_1} I_1 \\ \dot{I}_1 = \frac{(2 \cdot d - 1) E}{L_{11}} - \left( \frac{1}{L_{11}} + \frac{1}{L_{22}} \right) V_{c1} - \left( \frac{R_1}{L_{11}} - \frac{1}{C_2 \cdot R_2} \right) I_e - \left( \frac{1}{C_1 \cdot R_1} + \frac{1}{R_2 \cdot C_2} \right) I_1 \\ \quad - \left( \frac{1}{C_2 \cdot R_2 \cdot R_3} - \frac{1}{L_{22}} \right) V_{c2} - \frac{n \cdot d}{C_2 \cdot R_2} I_{L1} - \frac{n \cdot (1-d)}{C_2 \cdot R_2} I_{L2} \end{array} \right.$$



# Modélisation d'état du Système

- Représentation d'état sous forme canonique :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}$$

**A** : Matrice d'état,  
**B** : Matrice de Commande,  
**C** : Matrice de mesure

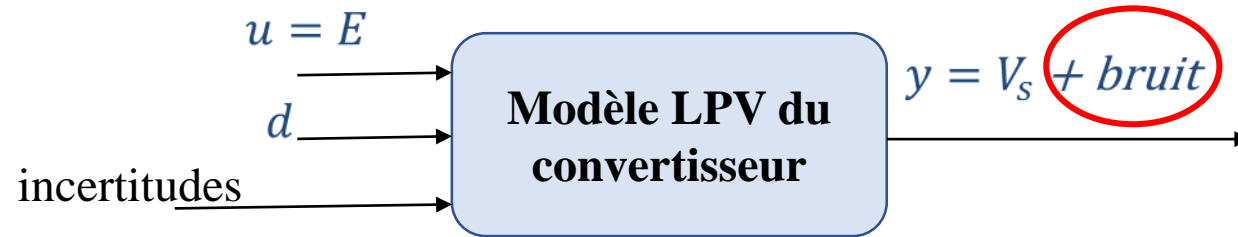
$$A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{C_e(R_{load}+ESR)} & \frac{R_{load}}{C_e(R_{load}+ESR)} & \frac{R_{load}}{C_e(R_{load}+ESR)} \\ -\frac{R_{load}}{L_1(R_{load}+ESR)} & -\frac{R_{load} ESR}{L_1(R_{load}+ESR)} & -\frac{R_{load} ESR}{L_1(R_{load}+ESR)} \\ -\frac{R_{load}}{L_2(R_{load}+ESR)} & -\frac{R_{load} ESR}{L_2(R_{load}+ESR)} & -\frac{R_{load} ESR}{L_2(R_{load}+ESR)} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{d n}{L_1} \\ -\frac{d n}{L_2} \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} \frac{R_{load}}{R_{load} + ESR} & \frac{R_{load} ESR}{R_{load} + ESR} & \frac{R_{load} ESR}{R_{load} + ESR} \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 = i_L \\ x_2 = V_s \end{pmatrix}$$

$$u = E \quad \text{et} \quad y = V_s$$



# Modélisation d'état par intervalle



$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A_f(\rho(t))x(t) + B_f(\rho(t))u(t) \\ y(t) = C_f x(t) + Fw(t) \end{cases}$$

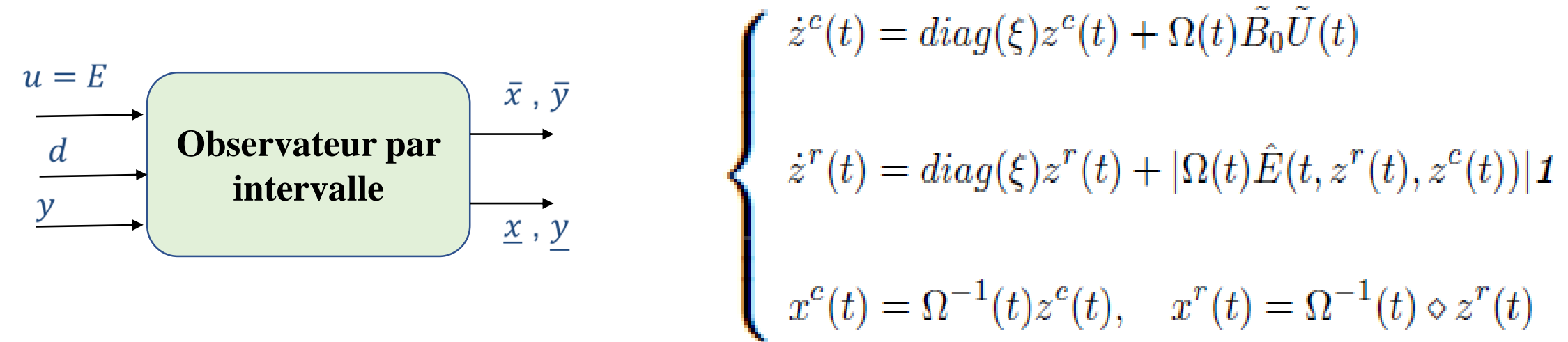
$$\begin{cases} \frac{1}{L_1} \pm \Delta L_1 \% \equiv \frac{1}{L_1} + \frac{0.1}{L_1} [-1, 1], \\ \frac{1}{L_2} \pm \Delta L_2 \% \equiv \frac{1}{L_2} + \frac{0.1}{L_2} [-1, 1], \\ \frac{1}{C_e} \pm \Delta C_e \% \equiv \frac{1}{C_e} + \frac{0.1}{C_e} [-1, 1]. \end{cases}$$

$$w(t) \in [-1, 1] \quad \rho(t) \in [-1, 1]$$





# Modélisation d'état par intervalle

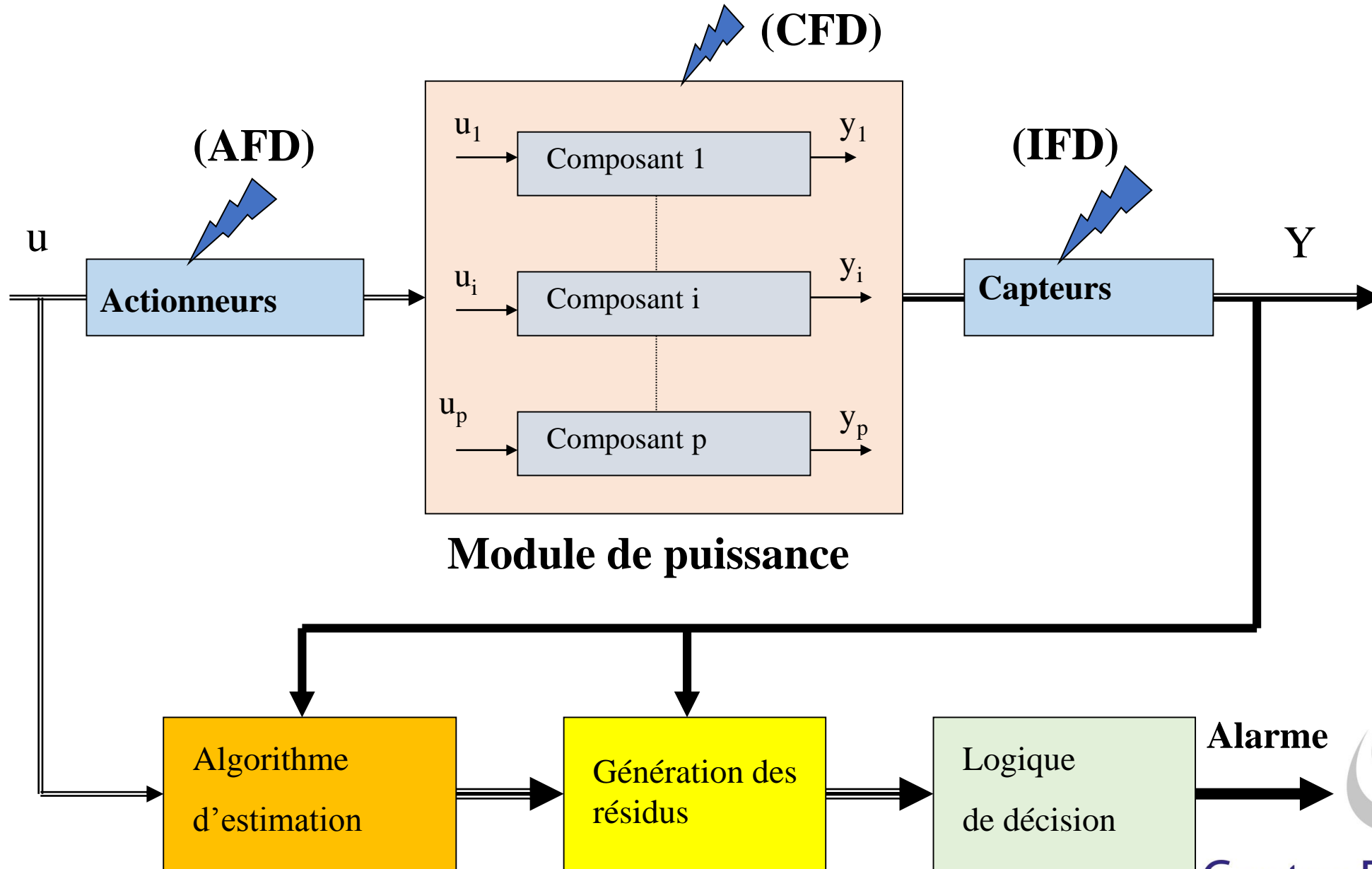


$$\left\{ \begin{array}{l} \Omega(t) = \text{diag}(e^{-i\omega t})\nu, \quad \Omega^{-1}(t) = \nu^{-1}\text{diag}(e^{i\omega t}) \\ \hat{E}(t, z^r(t), z^c(t)) = [-LF | \dots A_{f_i}\Omega^{-1}(t)z^c + B_{f_i}u(t) \dots | \dots A_{f_i}\Xi(t) \dots] \\ \Xi(t) = \Omega^{-1}(t)\Delta(z^r(t)) \text{ where } \Delta(z^r(t)) = [\text{diag}((z^r)^R(t)), i.\text{diag}((z^r)^I(t))] \in \mathbb{C}^{3 \times 6} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \underline{x}(t) = x^c(t) - x^r(t) \\ \bar{x}(t) = x^c(t) + x^r(t) \end{array} \right.$$



# Architecture de Détection



# Algorithme de détection

**Entrées:**  $u(t) = E$ ,  $y(t) = V_s$ ,  $L$ ,  $C_e$ ,  $ESR$ ,  $R_{load}$ ,  $d$ ,  $F$ ,  $x^c(0)$ ,  $x^r(0)$  | **Sortie:**  $res_{ave}$

1. Calculer le gain de l'observateur  $L$  tel que  $\tilde{A}_{f_0} = A_{f_0} - LC_f$  est  $\mathbb{C}$ -diagonalizable et stable.

2. Diagonaliser la matrice  $\tilde{A}_{f_0}$  et calculer  $\Omega(t) = \text{diag}(e^{-i\omega t})\nu$ .

3. Calculer les dynamiques de l'observateur par intervalle:

$$\dot{z}^c(t) = \text{diag}(\xi)z^c(t) + \Omega(t)\tilde{B}_0\tilde{U}(t),$$

$$\dot{z}^r(t) = \text{diag}(\xi)z^r(t) + |\Omega(t)\hat{E}(t, z^r(t), z^c(t))|\mathbf{1}.$$

4. Dédire les bornes supérieure et inférieure de l'états:

$$\underline{x}(t) = x^c(t) - x^r(t) = \Omega^{-1}(t)z^c(t) - \Omega^{-1}(t) \diamond z^r(t),$$

$$\bar{x}(t) = x^c(t) + x^r(t) = \Omega^{-1}(t)z^c(t) + \Omega^{-1}(t) \diamond z^r(t).$$

5. Calculer le résidu par intervalle:

$$res(t) = \begin{cases} y(t) - \bar{x}(t) & \text{si } y(t) > \bar{x}(t), \\ y(t) - \underline{x}(t) & \text{si } y(t) < \underline{x}(t), \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

6. Calculer le signal  $res_{ave}$ :

$$res_{ave} = \max_t \frac{1}{q} \sum_{k=1}^q res(k).$$

Le défaut est détecté si  $res_{ave} \neq 0$  et il est isolé en examinant la pente du signal  $res_{ave}$ , puisque pour chaque défaut on a une pente différente.



# Principaux résultats obtenus

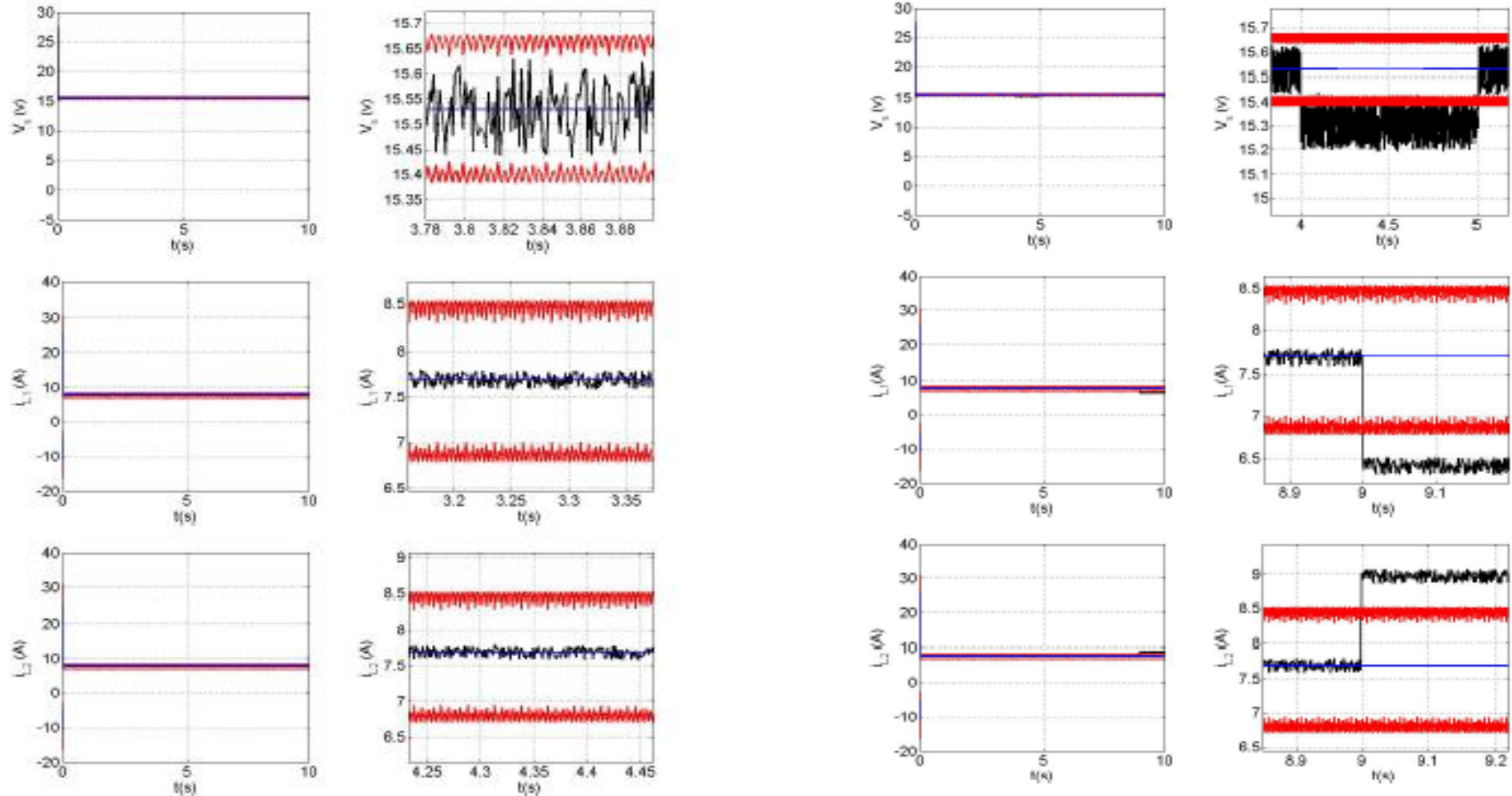
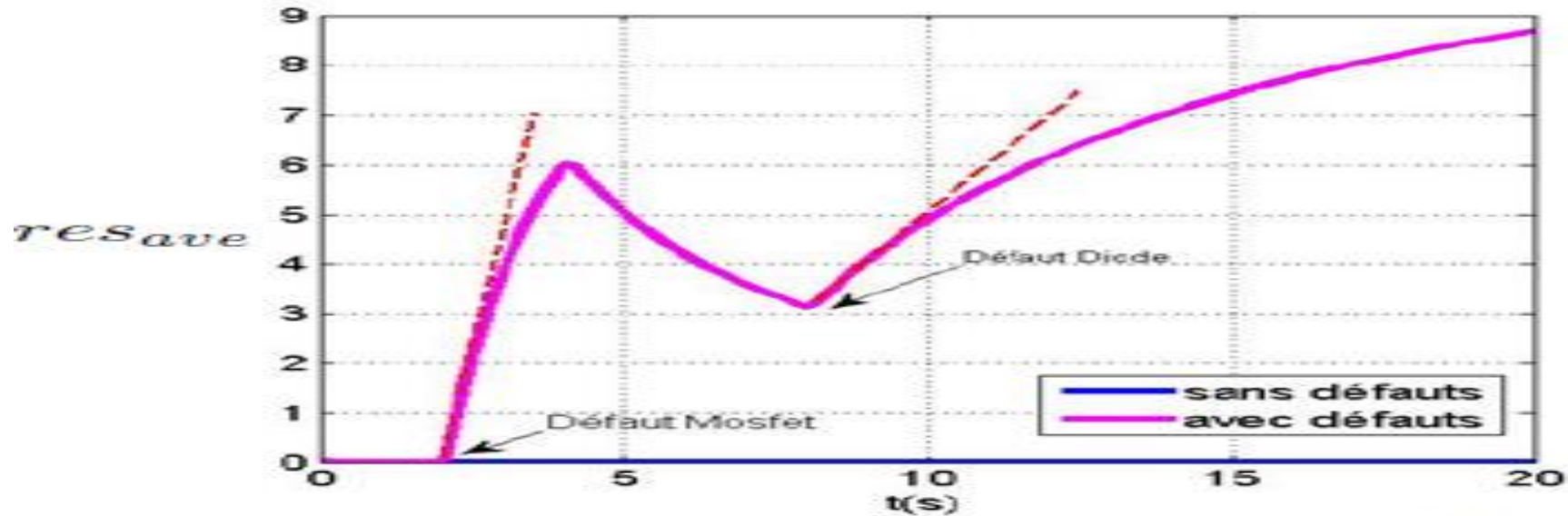
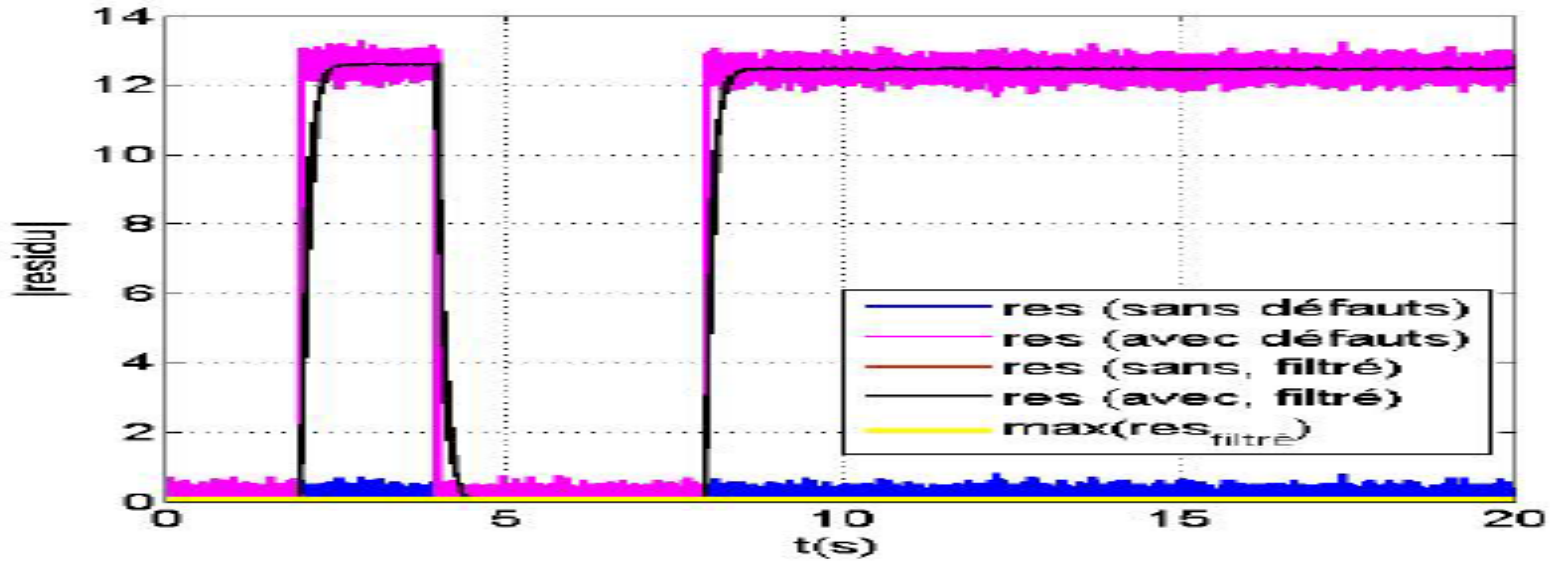


Fig. output vector and its bounds in fault-free case. Left: large view, Right: zoom. All plots: noise-free output vector (blue), noisy output vector (black) and its computed bounds  $\underline{y}(t), \bar{y}(t)$  (red).

Fig. output vector and its bounds in faulty cases. Left: large view, Right: zoom around the time of fault occurrence. All plots: noise-free output vector (blue), noisy output vector (black) and its computed bounds  $\underline{y}(t), \bar{y}(t)$  (red).

# Principaux résultats obtenus



Défaut Mosfet à  $t=2s$  et défaut diode à  $t=8s$ , pour les deux modèles





## □ Conclusion

- Modélisation du Convertisseur DC-DC en tenant compte des incertitudes,
- Proposition d'une Méthodologie pour la détection et la localisation de défauts,
- Pas besoin de seuil, robustesse et faible temps de calcul.

## □ Perspectives

- Prendre en considération le courant de fuite du condensateur,
- Du diagnostic à la fiabilité: suivre la dégradation des composants du système en se basant sur les pentes de l'indicateur «  $res_{ave}$  »:

variation de pente  variation des paramètres du système au court du temps.

